"西光所建所六十周年暨《光子学报》创刊五十周年"专辑

引用格式: GAO Peng, FANG Xiang, WEN Kai, et al. Large-field Structured Illumination Microscopy (Invited)[J]. Acta Photonica Sinica, 2022, 51(8):0851506

部鹏,方翔,温凯,等.大视场结构光照明显微技术(特邀)[J].光子学报,2022,51(8):0851506

大视场结构光照明显微技术(特邀)

部鹏,方翔,温凯,雷云泽,熊子涵,李娇月,刘星,郑娟娟,安莎 (西安电子科技大学物理学院,西安710071)

摘 要:结构光照明显微(SIM)具有成像速度快、对样品损伤小,以及对荧光标记物和标记程序无特殊 要求等优点,成为研究活细胞结构和动态过程的重要成像手段之一。介绍了一种大视场、双模式(条纹/ 点阵)SIM显微技术。该技术结合二维光栅投影产生条纹/点阵结构光,空间光调制器选择条纹方向和 实现相移,打破传统SIM中条纹数量受数字投影设备像素个数限制的瓶颈,同时保持了传统SIM成像 速度快的优势。实验结果表明:该技术在20×/0.75数值孔径物镜下可获得690 µm×517 µm 成像视场 和1.8倍空间分辨率提升,其空间带宽积是传统SIM的3倍。该技术有望被应用于生物学、化学和工业 等领域。

关键词:大视场;超分辨;结构光照明显微;荧光样品;点阵照明

中图分类号:O436 文献标识码:A

doi:10.3788/gzxb20225108.0851506

0 引言

光学显微镜具有结构简单、对样品损伤小(可对活体样品进行成像)、可对生物样品中特定结构(借助荧 光标记)进行选择性成像等优点,在了解物质和生命过程中发挥着决定性作用。然而,光学显微镜的空间分 辨率受衍射限制为λ/2(一般为200 nm)^[1]。人们为解决此问题,提出了超分辨率(Super Resolution, SR)显 微方法,如单分子定位显微(Single-Molecule Localization Microscopy, SMLM)^[2-4]、受激发射损耗显微 (Stimulated emission depletion, STED)^[5-7]和结构光照明显微(Structured Illumination Microscopy, SIM)^[8-14],将光学显微镜的空间分辨率提高到几十纳米甚至几纳米。2014年,发明超分辨光学显微技术的 三位科学家因此被授予诺贝尔化学奖。在SR技术中,SIM技术因其成像速度快、对样品损伤小,在活体样 品成像中脱颖而出。SIM利用照明光斑和样品之间的"莫尔效应",收集传统光学系统无法探测到的样品高 频信息,进而重构出超分辨图像。由于产生的结构光同样会收到物镜数值孔径(Numerical Aperture,NA)的 影响,线性SIM(激发的荧光与激发强度呈线性关系)的空间分辨率只能在衍射极限基础上提高两倍^[15]。相 比之下,非线性SIM通过利用发射模式中的高次谐波,实现了超过两倍的分辨率增强^[1]。结构光照明还可以 和定量相位显微相结合,实现对透明样品的高分辨、高衬度相位成像^[16]。

在传统 SIM 中,通常利用空间光调制器(Spatial Light Modulator, SLM)或数字微镜器件(Digital Micromirror Device, DMD)快速生成和切换不同方向及相移量的条纹结构光完成移相。然而,其成像通量 受到 SLM/DMD本身像素个数的限制。例如,对于采用100×/1.4NA 物镜和532 nm 激发光的 SIM 显微镜, 若要获得两倍的分辨率提升,SLM或 DMD 需产生周期为190 nm 的条纹/点阵结构光。受投影器件像素个数(如1920×1080 像素)的限制,该结构光场仅能覆盖90 μm×50 μm 的视场,无法满足组织或病理切片等 生物样品超分辨成像的需求。目前也存在几种扩展 SIM 成像视场的技术:首先,可以通过机械平移样品来

基金项目:中央高校基本科研业务费专项资金(No. QTZX22039),国家重点研发计划(Nos. 2022YFE0100700, 2021YFF0700300),国家 自然科学基金(No. 62075177),中国轻工业浓香型白酒固态发酵重点实验室开放基金(No. 2019JJ012),陕西省自然科学基金 (Nos. 2020JM-193, 2020JQ-324),瞬态光学与光子技术国家重点实验室开放基金(No. SKLTOP202001)

第一作者:部鹏(1983—),男,教授,博士,主要研究方向为超分辨光学显微、相位显微、荧光相关光谱技术。Email: peng.gao@xidian.edu.cn 收稿日期:2022-05-16;录用日期:2022-07-04

逐一拍摄样品的不同部位,然后对再现的 SIM 图像进行拼接获得大视场 SR 图像^[17, 18]。其次,还可以利用平面聚合物波导代替传统物镜获得较大的 SR-SIM 图像^[19]。其中,前者较为耗时,后者对样品的制备要求较高。此外,利用物理光栅在样品上的投影也可在大视场中产生条纹图案^[20, 21]。然而,该方法需要对光栅进行物理旋转(改变条纹方向)和平移(实现相移),限制了 SIM 的成像速度。

本文将介绍一种大视场条纹/点阵结构光照明显微技术。该技术利用物理光栅投影产生大通量条纹/ 点阵结构光,同时利用SLM快速实现结构光相移和条纹方向选择。与传统SIM技术相比,该技术可显著提 高成像通量;与条纹结构光相比,点阵结构光只需要记录五幅原始荧光图像,便可以获得样品的超分辨图 像,提高了成像速度。

1 实验装置

提出的大视场(条纹/点阵)结构光照明SIM^[22]装置如图1(a)所示:激光器发出的光经过偏振片P₁和P₂ 后,被扩束成平行光。该照明光经过二维光栅(80线对/mm)后分别在45°和-45°方位上产生±1级衍射光, 这四个光束经过透镜L₃后聚焦在空间光调制器(SLM,1920×1200像素,像素大小8μm,HDSLM80R,





(c) The phases loaded on the SLM to generate lattice patterns

图 1 大视场 SIM 的光路示意图 Fig. 1 The schematic setup of large-field SIM UPOLabs Co.,Ltd.,China)上的四个象限内。为了避免聚焦光束对 SLM 的损伤,实验中在 SLM 和透镜L3 的焦平面之间保留了一距离 d(例如 d=5 mm)。通过在四个象限上同时加载不同的灰度值图像和二进制光 栅(对两个正交方向上±1级衍射光的频谱进行调制)来实现结构光的相移或方向选择。被 SLM 相位调制 后的照明光频谱由望远镜系统 L₄-L₅进一步成像到一空间掩膜板(Mask)上。如图 1(a)中插图所示,该掩膜 板包含直径为 350 µm 和间距为 5.5 mm 的四个圆孔,以阻挡除 45°和-45°方位上的±1级衍射光之外的结构 光频谱。偏振方向分别为 s和 p 偏振的两个偏振片分别放置在 45°和-45°方向的±1级频谱位置上,避免两 个 正交方向上光束之间发生干涉。随后,生成的结构光条纹通过望远镜系统 L₅-L₆和由镜筒透镜 (Tube-lens, TL)和显微物镜(Microscopic Objective, MO)组成的望远镜系统 TL-MO 中继到样品平面。 通常,结构光场的频谱会充满物镜 MO 的后瞳,以便在样品平面上产生周期最小的正弦条纹图案。

在成像光路中,结构光照明激发所产生的荧光由望远镜系统 MO-TL 成像到 CMOS 相机(4 096×3 000 像素,像素尺寸 3.45 μm,Basler ace acA4112-20um,Basler 视觉技术(北京)有限公司,中国)上。在该成像光路中,二向色镜 DM(FF545/650-Di01-25×36,Semrock,USA)用来分离激发光和荧光。此外,在CMOS 相机前面放置了一个滤光片(FF01-562/40-25,Semrock,USA)阻挡来自背景的激发光束和杂散光。

传统 SIM 使用 SLM/DMD 生成条纹/点阵图案,其数量受 SLM/DMD 像素数量限制为 500 个左右(每 个周期用四个像素进行移相操作)。此外,由于 SLM/DMD 的离散化像素结构产生多级衍射光,降低所产生 的条纹质量和光强利用率^[23]。相比之下,所提出的方法将二维光栅和 SLM 相结合,能够生成1760 个条纹/ 光点(22 mm×80 线对/mm),达到传统 SIM 通量的 3 倍。同时,该方法采用 SLM 来实现相移操作,具有速 度快、操作简便、重复性好的优点。

2 大视场 SIM 的双模式成像

基于图1所示的实验光路,分别开展基于条纹结构光照明的SIM成像和基于点阵结构光照明的SIM成像。

2.1 基于条纹结构光的大视场 SIM

首先,验证将SLM和针孔滤波相结合产生一维结构光条纹的可行性。将SLM第三象限的灰度值固定为0,第一象限依次设置为0、 $2\pi/3$ 和 $4\pi/3$ 相移量时所需灰度值图像。同时,在第二象限和第四象限加载 $0-\pi$ 二进制相位光栅(如图1(b)所示),通过衍射和针孔滤波来抑制该象限上±1级衍射光束的光强,如图2(a)所示。图2(b)和(a)显示了在SLM上加载二进制光栅前后结构光的频谱分布。定量分析表明:在第二和第四象限加载 $0-\pi$ 二进制相位光栅后,经过针孔的光强仅为原来的4.5%,可以忽略不计。最终产生 45°方向条纹结构光,如图2(c)所示。采用类似操作即可获得-45°方向的一维条纹结构光。当SLM第一象 限分别加载 0、79和158灰度值时,可以获得 0、 $2\pi/3$ 和 $4\pi/3$ 相移的条纹结构光,如图2(e)所示。其沿同一虚 线的强度分布如图2(g)所示,对其正弦拟合结果表明,其相移分别为[0,1.84,4.67] rad,接近理论值[0, $2\pi/3$, $4\pi/3$] rad,因此该方法可提供准确相移。

其次,通过对直径为240 nm、荧光发射峰值波长为580 nm(λ_{em})的荧光小球(RF240C,激发波长532 nm, 辉质生物,上海,中国)进行成像,来证明条纹结构光照明大视场SIM的超分辨成像能力。在本实验中,使用 有效成像视场为690 µm×517 µm的低倍物镜(20×/NA0.75)(见图3(a)),其横向分辨率的理论值为 δ_{plan} = 0.61 λ_{em} /NA=472 nm。实验中,条纹结构光在样品平面上的周期 P_{SIM} 为0.69 µm。此时,SIM空间分辨率增 强倍率:[(2×NA/ λ_{em})+1/ P_{SIM}]/(2×NA/ λ_{em})=1.6^[24]倍,故而空间分辨率理论值可达247 nm。

实验中,利用SLM实现相移和选择条纹方向,同时利用CMOS记录样品在结构光照明下的荧光图像。 最后,通过SIM重建算法^[25,26]即可获得样品的超分辨SIM图像,如图3(a)所示。选取图3(a)中不同位置的 5个感兴趣区域对应的宽场图像和SIM图像进行放大比较。通过对虚线处两个相邻小球的强度曲线分析 (如图3(b)所示),可以发现SIM成像模式相比宽场成像模具有更高的空间分辨能力。为了定量评估横向分 辨率,从图3(a)中随机选择了20个荧光小球,统计结果如图3(c)所示,宽场图像的小球的半高全宽(Full Width at Half Maximum, FWHM)为543±20 nm,SIM对应的FWHM为302±13 nm,即SIM成像模式将空 间分辨率提升了1.8倍。需要指出的是,由于成像系统中存在像差,因此两种成像模式的空间分辨率均低于



(a) The spectral distribution of mask plane after loading the binary gratings to the second and fourth quadrants of the SLM



(c) The fringe structured illumination patterns generated by methods (a)



(e) Phase-shifted fringe structured illumination patterns generated by introducing phase shifts of 0, $2\pi/3$ and $4\pi/3$ in the first quadrant





(b) The spectral distribution of mask plane before loading the binary gratings to the second and fourth quadrants of the SLM



(d) The lattice structured illumination patterns generated by methods (b)



(f) Phase-shifted lattice structured illumination patterns generated by introducing phase shifts of 0, $2\pi/3$ and $4\pi/3$ in the first quadrant



(h) Intensity distributions along the dotted line in (f)

图 2 基于光栅投影和 SLM 相移的大视场条纹和点阵结构光 Fig. 2 Large-field fringe and lattice structured illumination based on grating projection and SLM phase shifting





理论分辨率,并且由于SIM重建中使用的去卷积操作有助于空间分辨率提升,进而实验测得的分辨率增强 倍率(1.8倍)高于理论分辨率增强倍率(1.6倍)。

除了分辨率增强外,空间带宽积(Spatial Bandwidth Product, SBP)也是光学成像系统的一个重要参量。 SBP越大,通过光学系统所获得的信息越多。SBP可以通过视场除以最小可分辨的有效区域来估计,对于 该系统,SBP可计算为:(4 000×3.45 μ m/20)×(3 000×3.45 μ m/20)/(π ×0.302² μ m²)=125万;对于传统 SIM,其有效视场受限于SLM/DMD的像素数,考虑到每个周期用3个像素采样,生成与该系统相同的条纹 (周期0.69 μ m)时,一个1920×1080像素的SLM/DMD只能覆盖442 μ m×248 μ m的视场(每个条纹周期 由4个像素所采样),对应有效SBP为:442×248 μ m²/(π ×0.302² μ m²)=38万。可得该系统相比传统SIM 具有3倍的SBP增强^[9]。

2.2 基于点阵结构光的大视场 SIM

基于图1所示实验光路,还可以用于产生二维点阵结构光,以更快的速度实现快速超分辨成像。相比条 纹结构光照明,在产生点阵结构光时无需在SLM上加载0-π二进制相位光栅。为了实现二维点阵的相移操 作,仅需在SLM四个象限加载不同灰度值图像。具体地,将SLM第三和第四象限的相位固定为0,将第一和 第二象限的相位进行成对变化(如图1(c)所示),可以实现对两组相互垂直的条纹结构光的相移操作。方便 起见,用φ_{i,i}和φ_{s,j}表示第一和第二象限的相位,下标*i*和*j*分别表示在第一和第二象限上执行的相移次数。具 体地,依次在SLM[第一象限,第二象限]上加载[0,0]、[0,2π/3]、[0,4π/3]、[2π/3,0]和[4π/3,2π/3]的相位 组合,来获得5组点阵结构光。图2(d)为相移量组合[0,0]时的结构光图案,图2(f)和(h)分别为对应相移量 组合[0,0]、[0,2π/3]、[0,4π/3]的相移点阵结构光图案和强度分布。通过对强度曲线正弦拟合可以得出,此 例中点阵结构光的相移误差为0.26 rad,说明该方法具有较高的相移精度。通过依次记录样品在以上5组点 阵结构光照明下的低分辨荧光图像,结合再现方法,便可得到空间分辨率超越衍射极限的SIM图像。 简要介绍点阵结构光的再现方法。在点阵SIM中,点阵图案是由两组垂直的条纹结构光非相干叠加生成的,因此其强度分布可以表示为

$$I_{i,j}(\mathbf{r}) = I_0 \Big[2 + m_s \cos \Big(2\pi \mathbf{\kappa}_s \cdot \mathbf{r} + \varphi_{s,i} \Big) + m_t \cos \Big(2\pi \mathbf{\kappa}_t \cdot \mathbf{r} + \varphi_{t,i} \Big) \Big]$$
(1)

式中,r表示二维空间位置矢量; $I_0(r)$ 表示点阵光的直流分量; m_s 、 m_t 是沿45°和-45°方向条纹结构光的调制深度; κ_s 和 κ_t 是分别沿45°和-45°方向两组正交条纹的空间频率。

在点阵结构光 $I_{i,j}(r)$ 的照明下,被荧光标记的样品S(r)由显微成像单元MO-TL成像到CMOS相机。此时,样品的荧光图像强度分布为 $S \cdot I_{i,j}(r)$ 与系统的强度点扩散函数 $h_{\rm D}(r)$ 的卷积,即

$$D_{i,j}(\mathbf{r}) = \left[S \cdot I_{i,j} \right] \otimes h_D \tag{2}$$

式中,D_{i,j}(**r**)表示相机记录的强度分布。对式(2)进行傅里叶变换,可得

$$\tilde{D}_{i,j}(\boldsymbol{k}) = (\hat{S} \otimes \tilde{I}_{i,j}) \cdot \tilde{h}_D$$
(3)

式中,k为频率域的坐标矢量, $\tilde{D}_{i,j}(k)$ 、 $\tilde{h}_{D}(k)$ 、 $\tilde{S}(k)$ 和 $\tilde{I}_{i,j}(k)$ 分别为 $D_{i,j}(r)$ 、 $h_{D}(r)$ 、S(r)和 $I_{i,j}(r)$ 的频谱。将式 (1)代入式(3)可得

$$\tilde{D}_{i,j}(\boldsymbol{k}) = 2\tilde{C}_0 + \frac{m_s}{2}\tilde{C}_{s,1}\exp(\mathrm{i}\varphi_{s,i}) + \frac{m_s}{2}\tilde{C}_{s,-1}\exp(-\mathrm{i}\varphi_{s,i}) + \frac{m_t}{2}\tilde{C}_{t,1}\exp(\mathrm{i}\varphi_{t,j}) + \frac{m_t}{2}\tilde{C}_{t,-1}\exp(-\mathrm{i}\varphi_{t,j}) \quad (4)$$

$$\vec{x} \neq ,$$

$$\begin{cases} \tilde{C}_{0}(\boldsymbol{k}) = \tilde{S}(\boldsymbol{k}) \cdot \tilde{h}_{D}(\boldsymbol{k}) \\ \tilde{C}_{s,1}(\boldsymbol{k}) = \tilde{S}(\boldsymbol{k} - \boldsymbol{\kappa}_{s}) \cdot \tilde{h}_{D}(\boldsymbol{k}) \\ \tilde{C}_{s,-1}(\boldsymbol{k}) = \tilde{S}(\boldsymbol{k} + \boldsymbol{\kappa}_{s}) \cdot \tilde{h}_{D}(\boldsymbol{k}) \\ \tilde{C}_{i,1}(\boldsymbol{k}) = \tilde{S}(\boldsymbol{k} - \boldsymbol{\kappa}_{i}) \cdot \tilde{h}_{D}(\boldsymbol{k}) \\ \tilde{C}_{i,-1}(\boldsymbol{k}) = \tilde{S}(\boldsymbol{k} + \boldsymbol{\kappa}_{i}) \cdot \tilde{h}_{D}(\boldsymbol{k}) \end{cases}$$

$$(5)$$

通过记录样品在结构光照明下的5幅荧光图像,可以求解出 $\tilde{C}_{0}(\mathbf{k})$ 、 $\tilde{C}_{s,1}(\mathbf{k})$ 、 $\tilde{C}_{s,-1}(\mathbf{k})$

点阵 SIM 比条纹结构光照明 SIM 具有更快的成像速度。SLM 的帧速率(Frames Per Second, FPS)为 60 帧/s, CMOS 相机在全帧曝光模式下的最大帧速率为 23 帧/s。条纹结构光 SIM 需要拍摄 6 幅原始图像重 建单幅超分辨图像,因此其超分辨率成像速度最快为 23/6 帧/s。相比之下,点阵结构光 SIM 需要记录 5 幅 原始图像来重构一幅超分辨图像,因此点阵结构光 SIM 超分辨率成像速度为 23/5 帧/s。

同样利用直径为240 nm的荧光小球验证点阵结构光照明大视场SIM的超分辨成像能力。图4(a)所示



(a) Intensity images of fluorescent beads obtained under the lattice illumination with the phase shift combination of [0, 0], $[0, 2\pi/3]$, $[0, 4\pi/3]$, $[2\pi/3, 0]$, and $[4\pi/3, 2\pi/3]$. Scalebars indicate 100 µm, 8 µm, and 2 µm, respectively

(b) The frequency spectrum with the phase shift combination of [0, 0]

图 4 点阵结构光照明下荧光小球的原始荧光图像 Fig. 4 Raw fluorescence image of fluorescent beads under lattice illumination 分别为在相移组合[0,0]、[0,2 π /3]、[0,4 π /3]、[2 π /3,0]和[4 π /3,2 π /3]结构光照明对应的5幅荧光图像 $I_{\text{rs},0}$ (x, y)、 $I_{r,1}(x, y)$ 、 $I_{r,-1}(x, y)$ 、 $I_{s,1}(x, y)$ 和 $I_{s,-1}(x, y)$ 。其中,从图4(a)的放大图像中可以明显看到二维点阵 结构光对应的"棋盘"图样。同时,从 $I_{\text{rs},0}(x, y)$ 的频谱分布中可以看出(如图4(b)所示),其频谱由沿着±45° 方向的0,±1级衍射光频谱组成,该结果表明点阵结构光照明光是由两组正交方向的条纹结构光非相干叠 加而成,且不同结构光之间不存在交叉干涉项。

利用再现方法获得不同方向的频率分量后,结合与传统 SIM 相同的重构方式,荧光小球的超分辨 SIM 图像如图 5(a)所示,为了便于比较,在图中并列放置了该样品对应的宽场荧光图像。通过对图中感兴趣区 域对应的宽场荧光图像和 SIM 图像进行放大比较,且对两个相邻小球进行强度曲线分析可以发现,SIM 图像能够展现出样品更多的细节结构。此外,从图 5(a)中随机选择 20个荧光小球,并统计其强度分布的半高 全宽(FWHM),如图 5(c)所示。统计结果为,宽场成像的小球的 FWHM 为 560±30 nm,SIM 对应的 FWHM 为 313±24 nm,即结构光照明将空间分辨率提升了 1.78 倍。

为了进一步验证点阵结构光照明大视场 SIM 的超分辨成像能力,分别利用宽场和点阵 SIM 对小鼠干细



(a) Wide-field (left) and lattice SIM (right) images of the fluorescent beads. The two insets show enlarged wide-field and lattice SIM images of the boxes





胞中的微管结构进行成像。实验中,用一级抗体(β-Tubulin, $\sharp 2146$, 兔抗)和二级抗体(IgG(H+L)-Alexa Fluor 532, 羊抗兔)标记小鼠干细胞中的微管结构。图 6(a)的左右两侧分别为该样品的宽场和基于点阵结 构光的 SIM 图像。图 6(b)放大展示了图 6(a)中橙色方框对应子区域的宽场和 SIM 图像,对比发现 SIM 图 像具有更多细节结构和更高的信噪比。其中,前者受益于 SIM 的超分辨能力,后者受益于 SIM 的层析能力。 为了更加直观地比较宽场图像和 SIM 图像的空间分辨能力,图 7(a)展示了图 6(b)中宽场和 SIM 图像中相 同虚线位置的强度分布。对比两条曲线可以看出:点阵结构光照明 SIM 可分辨宽场成像无法分辨的微管结构。同时,利用基于去相关空间分辨率的分析方法^[27]对图 6(b)中宽场和 SIM 图像进行评定。图 7(b)和(c) 中的分析结果表明:宽场和 SIM 图像的空间截止频率分别为 3.0 μ m⁻¹和 6.4 μ m⁻¹,对应空间分辨率分别为 0.67 μ m 和 0.31 μ m。需要说明的是,由于点阵结构光照明 SIM 通过评估信号和噪声之间的相对权重来测定 空间分辨率,与宽场成像相比分辨率提升超过两倍;并且该方法中的相移操作可以抑制离焦背景噪声,使空 间分辨率的预测值也得到了提升。与 SBP 分析类似,基于光栅投影和 SLM 相移的点阵结构光 SIM 相比传统 SIM 具有 3倍的 SBP 增强^[9]。



(a) Wide-field image (left) and lattice SIM image (right) of the sample





(b) Magnified view of a region indicated with a box in (a): ① wide-field image and ② lattice SIM image







3 结论

本文介绍了一种基于光栅投影和 SLM 相移的大视场 SIM 技术。基于同一实验装置,实现了条纹结构 光照明和点阵结构光照明,具有成像速度快、视场大、分辨率高的优点。与传统基于 SLM/DMD 投影的 SIM 技术相比,该方法产生结构光的个数不受投影器件限制,其成像通量是传统 SIM 的 3倍(目前主要受限于 CMOS 相机的通量)。该技术通过采用振幅光栅投影,避免了 SLM/DMD 投影中的色散效应,可以直接用 于多色 SIM 成像。与现有的基于光栅投影的 SIM 相比,该方法利用 SLM 进行相移,具有更快的成像速度 (目前受制于 CMOS 相机的曝光时间,最终超分辨成像速度最快为 23/5 帧/s)。目前,结构光的照明方向被 限制在两个正交方向。通过采用 Dammam 光栅,可在三个或更多方向上生成结构光照明,从而实现各向同 性的空间分辨率增强。然而,大视场 SIM 也存在一些不足:首先,当采用单向条纹结构光照明时,会损失 50% 的光照强度;其次,由于需要同时使用物理光栅和 SLM 来产生相移结构光,具有相对复杂的装置。点 阵结构光照明与条纹结构光照明相比各有优势,点阵结构光照明仅需要记录5幅原始强度图样就可以重建 出样品超分辨相位图像,具有更快的成像速度;另外条纹结构光可以充分利用 CMOS 相机的灰度阶(不需要 复用两组正交结构光照明下的强度图像),具有更高的信噪比。

随着人工智能(尤其是深度学习技术)的不断发展,大视场结构光照明SIM的超分辨重建速度,以及相位/荧光双模式成像的融合速度将会得到大幅提升。期望本文介绍的结构光照明显微技术可以被广泛地应用于生物医学、材料化学等研究领域。

参考文献

- GUSTAFSSON M G L. Nonlinear structured-illumination microscopy: wide-field fluorescence imaging with theoretically unlimited resolution[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2005, 102(37):13081–13086.
- [2] RUST M J, BATES M, ZHUANG X. Sub-diffraction-limit imaging by stochastic optical reconstruction microscopy (STORM)[J]. Nature Methods, 2006, 3(10):793-796.
- [3] SIGAL Y M, ZHOU R, ZHUANG X. Visualizing and discovering cellular structures with super-resolution microscopy[J]. Science, 2018, 361(6405):880-887.
- [4] AN Sha, DAN Dan, YU Xianghua, et al. Progress and prospect of research on single-molecule localization super-resolution microscopy (invited review)[J]. Acta Photonica Sinica, 2020, 49(9): 0918001.
 安莎,但旦,于湘华,等.单分子定位超分辨显微成像技术研究进展及展望(特邀综述)[J].光子学报, 2020, 49(9): 0918001.
- [5] HELL S W, WICHMANN J. Breaking the diffraction resolution limit by stimulated emission: stimulated-emissiondepletion fluorescence microscopy[J]. Optics Letters, 1994, 19(11):780-782.
- [6] GAO P, PRUNSCHE B, ZHOU L, et al. Background suppression in fluorescence nanoscopy with stimulated emission double depletion[J]. Nature Photonics, 2017, 11(3):163–169.
- [7] WANG Jialin, YAN Wei, ZHANG Jia, et al. New advances in the research of stimulated emission depletion super-resolution microscopy[J]. Acta Physica Sinica, 2020, 69(10):108702.
 王佳林,严伟,张佳,等.受激辐射损耗超分辨显微成像系统研究的新进展[J].物理学报, 2020, 69(10):108702.
- [8] SHAO L, KNER P, REGO E H, et al. Super-resolution 3D microscopy of live whole cells using structured illumination [J]. Nature Methods, 2011, 8(12):1044-1046.
- [9] WEN K, GAO Z, FANG X, et al. Structured illumination microscopy with partially coherent illumination for phase and fluorescent imaging[J]. Optics Express, 2021, 29(21):33679-33693.
- [10] DAN D, LEI M, YAO B, et al. DMD-based LED-illumination Super-resolution and optical sectioning microscopy[J]. Scientific Reports, 2013, 3(1):1116.
- [11] CHEN Y, CAO R, LIU W, et al. Widefield and total internal reflection fluorescent structured illumination microscopy with scanning galvo mirrors[J]. Journal of Biomedical Optics, 2018, 23(4):046007.
- [12] QIN J, GUO Y, XUE B, et al. ER-mitochondria contacts promote mtDNA nucleoids active transportation via mitochondrial dynamic tubulation[J]. Nature Communications, 2020, 11(1):4471.
- [13] LIU Zhi, LUO Zewei, WANG Zhengyin, et al. Super-resolution fluorescence microscopy image reconstruction algorithm based on structured illumination[J]. Chinese Journal of Lasers, 2021,48(3):0307001.
 刘智,罗泽伟,王正印,等.基于结构照明的超分辨荧光显微成像重建算法[J].中国激光,2021,48(3):0307001.
- [14] SHAH Z H, MÜLLER M, WANG T C, et al. Deep-learning based denoising and reconstruction of super-resolution structured illumination microscopy images[J]. Photonics Research, 2021, 9(5): B168-B181.
- [15] GUSTAFSSON M G L. Surpassing the lateral resolution limit by a factor of two using structured illumination microscopy
 [J]. Journal of Microscopy, 2000, 198(2):82-87.
- [16] GAO P, YUAN C. Resolution enhancement of digital holographic microscopy via synthetic aperture: a review[J]. Light: Advanced Manufacturing, 2022, 3(1):6.
- [17] YEH L H, CHOWDHURY S, WALLER L. Computational structured illumination for high-content fluorescence and phase microscopy[J]. Biomedical Optics Express, 2019, 10(4):1978-1998.
- [18] ZHONG Q, JIANG C, ZHANG D, et al. High-throughput optical sectioning via line-scanning imaging with digital structured modulation[J]. Optics Letters, 2021, 46(3):504-507.
- [19] ENGDAHL A K, BELLE S, WANG T C, et al. Large field-of-view super-resolution optical microscopy based on planar polymer waveguides[J]. ACS Photonics, 2021, 8(7):1944-1950.
- [20] HEINTZMANN R, CREMER C. Laterally modulated excitation microscopy: improvement of resolution by using a diffraction grating[C]. SPIE, 1999, 3568(3):185-196.

- [21] ZHENG Q, ZHOU J, CHEN Q, et al. Rapid prototyping of a dammann grating in DMD-based maskless lithography[J]. IEEE Photonics Journal, 2019, 11(6):1-10.
- [22] WEN K, FANG X, MA Y, et al. Large-field structured illumination microscopy based on 2D grating and spatial light modulator[J]. Optics Letters, 2022, 47(11):2666-2669.
- [23] ABDELSALAM D G, YAO B, GAO P, et al. Single-shot parallel four-step phase shifting using on-axis Fizeau interferometry[J]. Applied Optics, 2012, 51(20):4891-4895.
- [24] BROWN P T, KRUITHOFF R, SEEDORF G J, et al. Multicolor structured illumination microscopy and quantitative control of polychromatic light with a digital micromirror device[J]. Biomedical Optics Express, 2021, 12(6):3700-3716.
- [25] LAL A, SHAN C, XI P. Structured illumination microscopy image reconstruction algorithm[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 2016, 22(4):50-63.
- [26] MÜLLER M, MÖNKEMÖLLER V, HENNIG S, et al. Open-source image reconstruction of super-resolution structured illumination microscopy data in ImageJ[J]. Nature Communications, 2016, 7(1):10980.
- [27] DESCLOUX A, GRUBMAYER K S, RADENOVIC A. Parameter-free image resolution estimation based on decorrelation analysis[J]. Nature Methods, 2019, 16(9):918-924.

Large-field Structured Illumination Microscopy (Invited)

GAO Peng, FANG Xiang, WEN Kai, LEI Yunze, XIONG Zihan, LI Jiaoyue, LIU Xing, ZHENG Juanjuan, AN Sha

(School of Physics and Optoelectronic Engineering, Xidian University, Xi'an 710071, China)

Abstract: Structured Illumination Microscopy (SIM) has the merits of fast imaging speed, minimal invasion, and no additional requirement on fluorophores and labeling strategies, and hence it is one of the premier imaging tools for studying the structure and dynamic processes of living cells. In this paper, we report a large-filed, dual-modality structured illumination microscopy technique, which is constructed by combining a 2D grating for fringe/lattice projection and a spatial light modulator (SLM) for selecting fringe orientation and phase-shifting. Both stripe SIM (using fringe patterns) and lattice SIM (using lattice patterns) can be performed using the same setup, providing super-resolution images and optically sectioned images.

First, a 2D grating is used to project fringe or lattice patterns. The interference of the ± 1 diffraction orders of the grating in the -x and -y directions yields two groups of fringe patterns, forming 2D grid patterns if superimposed. Two polarizers with their polarization azimuth of 90° and 0° (i.e., -s and -p polarizations) are respectively placed on the spectra of the ± 1 st orders along the -x and -y directions and these polarizations can be maintained during the whole imaging process. Hence, the two groups of fringe patterns along the -x and -y directions are incoherent. Nowadays, advanced manufacturing techniques can fabricate larger-scale gratings with small periods, of which the number is tens of folds of the patterns generated by SLMs or Digital Micromirror Devices (DMDs). Second, an SLM is used to perform phase shifting and select the orientation of fringe illumination. Specifically, phase shifting of the fringe/lattice patterns is performed by phase modulating the $+1^{st}$ orders of the generated fringe/lattice field on a plane close to the Fourier plane, where the spectra of the ± 1 diffraction orders are separate from each other. We mean to set a defocusing distance between the Fourier plane and the SLM plane, so that the broadlyextended defocused spectrum can be well sampled by hundreds of SLM pixels, avoiding the injury of the SLM by the laser light. For stripe SIM, 1D fringe illumination can be selected by loading binary gratings on the spectra of unwanted fringes and further blocking the relayed spectra with a filtering mask. For lattice SIM, two groups of the fringe patterns will be used simultaneously, and the patterns are phase-shifted in two directions. The proposed method preserves the advantage of high-speed phase-shifting in conventional SLM/DMD-based SIM.

Experiments demonstrate that both the stripe SIM and lattice SIM can achieve 1.8-fold spatial resolution enhancement in a large field of 690 μ m \times 517 μ m under a 20 \times /0.75NA objective. In addition, Both modalities can achieve a three-fold SBP enhancement above conventional SIM. Stripe SIM (using fringe illumination) allows for reconstructing a super-resolution image by recording six raw intensity

images (three phase-shifts in each of two orthogonal directions). While, lattice SIM can reconstruct a super-resolution image by recording five phase-shifted intensity images, enhancing imaging speed and reducing photo-bleaching by 17%. Stripe SIM is superior to lattice SIM when imaging samples with low brightness or imaging structures in complex environments.

The proposed method also has disadvantages: first, the period of the fringe/lattice patterns can not be varied digitally like what in SLM/DMD-based SIM. Second, the resolution enhancement achieved with this method is less isotropic than the standard 3-angle 2-beam SIM. Both drawbacks can be solved by using a specially-designed Diffractive Optical Element (DOE) instead of the 2D grating used in the current technique and by recording more raw images under different phase-shift combinations. Once using a 2D amplitude grating that has the same transmittance for different illumination wavelengths, the large-field SIM also allows multi-color SIM imaging. We can envisage that the proposed method can be applied to many fields, including biomedical, industrial, and chemical fields.

Key words: Large-field; Super-resolution; Structured illumination microscopy; Fluorescent sample; Lattice illumination

OCIS Codes: 180.2520; 170.0110; 170.2520; 330.6130; 350.5730

Foundation item: Fundamental Research Funds for the Central Universities (No. QTZX22039), National Key Research and Development Program of China (Nos. 2022YFE0100700, 2021YFF0700300), National Natural Science Foundation of China (No. 62075177), Key Laboratory of Wuliangye-flavor Liquor Solid-state Fermentation, China National Light Industry (No.2019JJ012), China Scholarship Council, Natural Science Foundation of Shaanxi Province (Nos. 2020JM – 193, 2020JQ – 324), Open Research Fund of State Key Laboratory of Transient Optics and Photonics (No.SKLTOP202001)